

御中

## プロダクト/プロセス変更通知書 Product/Process Bulletin (PB)

件名: i.MX51 19mmx19mm品 コンシューマ向け低温試験削除のお知らせ

《お願い》  
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、  
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。  
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2010年10月12日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

Japan Regional Marketing

該当GPCN番号:

14321

## 変更内容:

異なる8ロットのウェファの35600個で、同一プロセス、ウェファ工場、マスクセットの製品が6週間以上、低温試験において不良がなかったため、ファイナル・テストのフローを変更します。  
従来のファイナルテスト・フロー：高温→低温→QAゲート  
新しいファイナルテスト・フロー：高温→QAゲート

## 変更理由:

テストの効率化

## 対象製品:

MCIMX512DJM8C  
MCIMX513DJM8C  
MCIMX515DJM8C

## 変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2010/10/13

## 変更品の見分け方:

なし

車載対応品は対象外です